

# efit+ for TCU Ver.1.4.2.0 アップデート概要

2016年4月  
株式会社 ニコン・トリンプル

本書では、efit+ for TCU Ver.1.4.2.0 で追加、変更された機能の概要を説明します。

## ■ ソフトウェア構成表

◆efit+ for TCU Ver.1.4.2.0 の製品構成は下記の通りです。

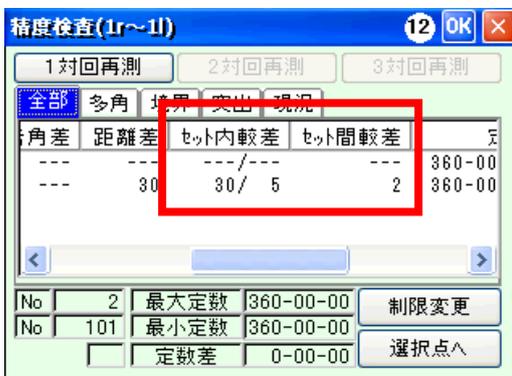
製品名	コード	備考	改良
efit+T 測量基本ソフト	B-E1-T00	基本キットに含まれます	ノンプリズム設定の入力制限値変更
efit+T 測量観測	B-E1-T50	基本キットに含まれます	地籍準則改定対応
efit+T 測量計算	B-E1-T51		
efit+T 線形計算	B-E1-T52		
efit+T 縦横断観測	B-E1-T53		横断観測修正
efit+T 平板観測	B-E1-T54		
efit+T GPS観測	B-E1-T55		
efit+T オートフォーカスOP	B-E1-T56		
efit+T 地籍観測	B-E1-T57		地籍準則改定対応
efit+T Nikon通信OP	B-E1-T58		
efit+T 定点観測	B-E1-T59		

## ■ 地籍準則改定対応

平面観測、地籍観測オプション

### ◆平面観測

精度検査画面に距離の「セット内較差」と「セット間較差」を追加しました。  
制限チェックは、「距離差制限」の値でチェックを行います。



セット内較差: 1 セット目の較差/2 セット目の較差を表示します。

セット間較差: 1 セット目の平均値と 2 セット目の平均値を表示します。

### ◆図根点観測

- 「図根多角測量」の場合、下表の通りに観測と精度検査が行えるようになりました。

精度区分	甲一/甲二	甲三/乙一	乙二/乙三
対回数	2 対回	1 対回	1 対回
鉛直数	1 対回	1 対回	1 対回
距離セット数	2 セット	2 セット	2 セット
較差制限	--	20 秒	40 秒
観測差制限	20 秒	--	--
倍角差制限	30 秒	--	--
定数差制限	30 秒	60 秒	60 秒
距離セット間較差	20mm	20mm	20mm
距離セット間較差	20mm	20mm	20mm

- 「細部図根測量」の場合、下表の通りに観測と精度検査が行えるようになりました。

精度区分	甲一	甲二	甲三	乙一	乙二/乙三
対回数	2 対回	2 対回	1 対回	1 対回	2 対回
鉛直数	1 対回				
距離セット数	2 セット				
較差制限	--	--	20 秒	40 秒	--
観測差制限	20 秒	40 秒	--	--	40 秒
倍角差制限	30 秒	60 秒	--	--	60 秒
定数差制限	30 秒	60 秒	60 秒	60 秒	60 秒
距離セット間較差	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
距離セット間較差	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm

- 精度検査画面の距離差を「セット内(1 セット/2 セット)」と「セット間」に分割します。

#### ◆ 突出点観測

- 検測点の較差の制限を次表のように変更しました。

精度区分	甲一	甲二	甲三	乙一	乙二	乙三
制限	40mm	60mm	100mm	120mm	160mm	200mm

- 検測精度検査画面については変更ありません。(制限値のみ変更)

#### ◆ 筆界点観測

- 検測点の較差の制限を次表のように変更しました。

精度区分	甲一	甲二	甲三	乙一	乙二	乙三
制限	30mm	50mm	90mm	120mm	160mm	200mm

- 検測精度検査画面については変更ありません。(制限値のみ変更)

## ■ その他

### ◆ ノンプリズム設定

「UTL→TS 機器設定→ノンプリズム設定」内の「距離レンジの最短距離」の下限値を「2m」から「1m」に変更しました。

12 OK X

標準偏差  m m

距離レンジ

最短距離  m

最長距離  m

### ◆ 平面観測

野帳計算の距離丸めを「UTL→環境設定→計算条件」内の「座標丸め(丸め、浮動)」を参照して行うようになりました。

12 OK X

座標計算	丸め処理
座標丸め	丸め処理 浮動処理
倍面積丸め	6桁 四捨五入
距離丸め	3桁 四捨五入
角度丸め	0桁 四捨五入
真数丸め	浮動 四捨五入
倍面積丸め	6桁 切り捨て
面積丸め	7桁 切り捨て

以上